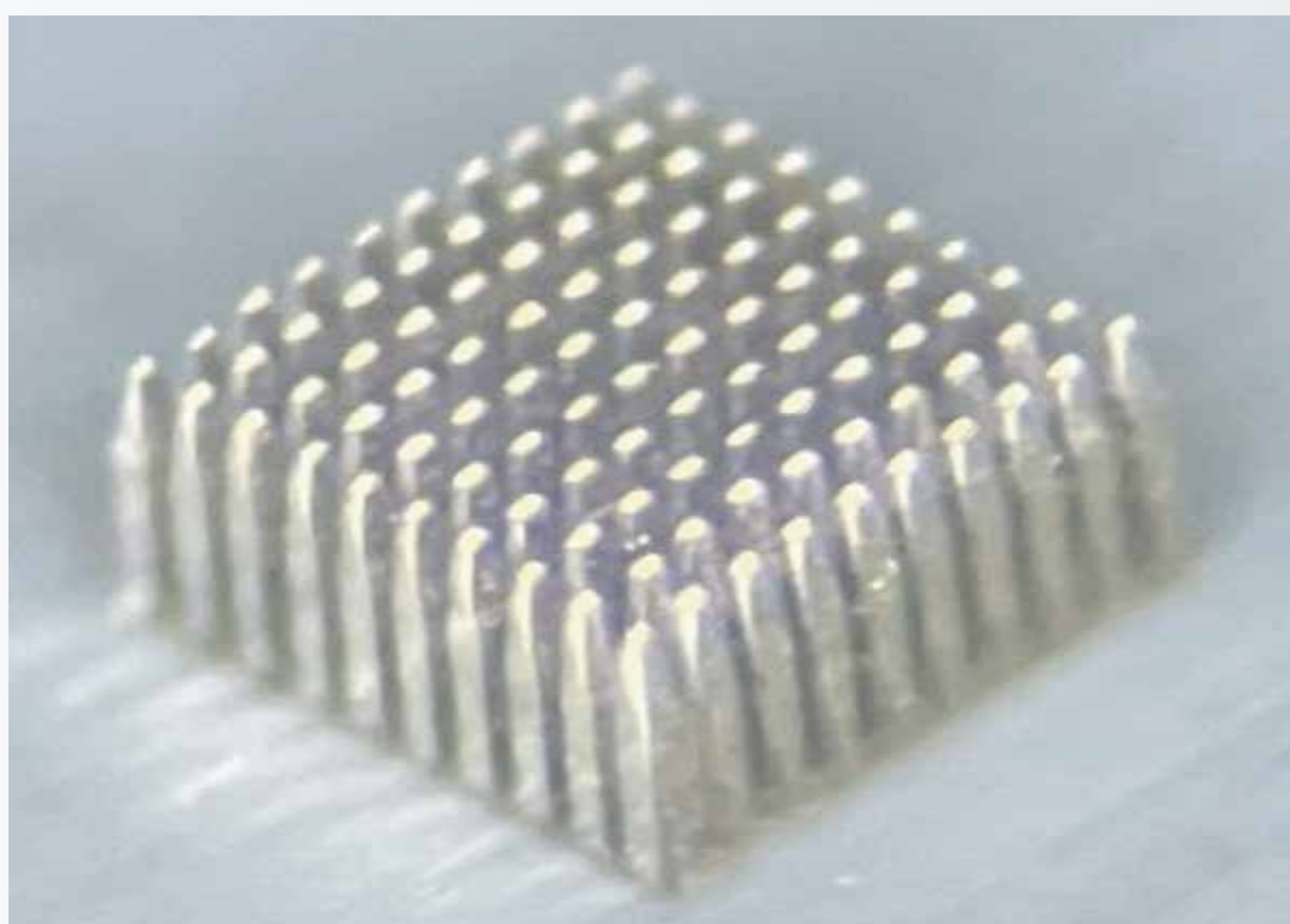




高精度なメッキ技術により挟ピッチに対応
Achieving Fine Pitch with High-Precision Plating

スクエア断面とスリット構造によりCCCを向上
Enhanced CCC by Square Cross-Section and Beam Slit Design

先端に高硬度な材料を採用することでライフを向上
Enhanced Lifetime by Adopting Hard Material on Probe Tips

■ プローブ使用例(先端) Probe Usage Example (Tip)

■ Probe enlargement

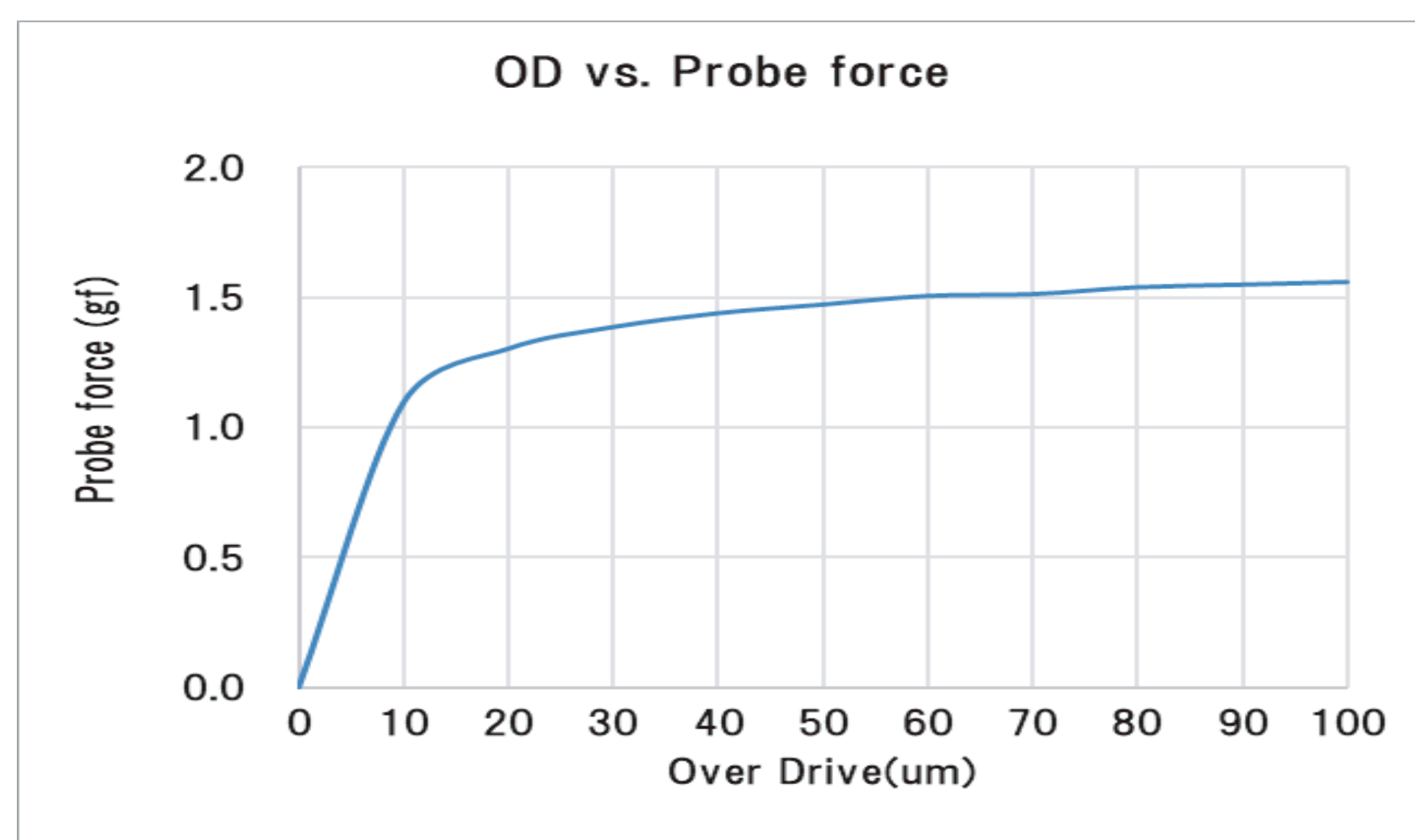
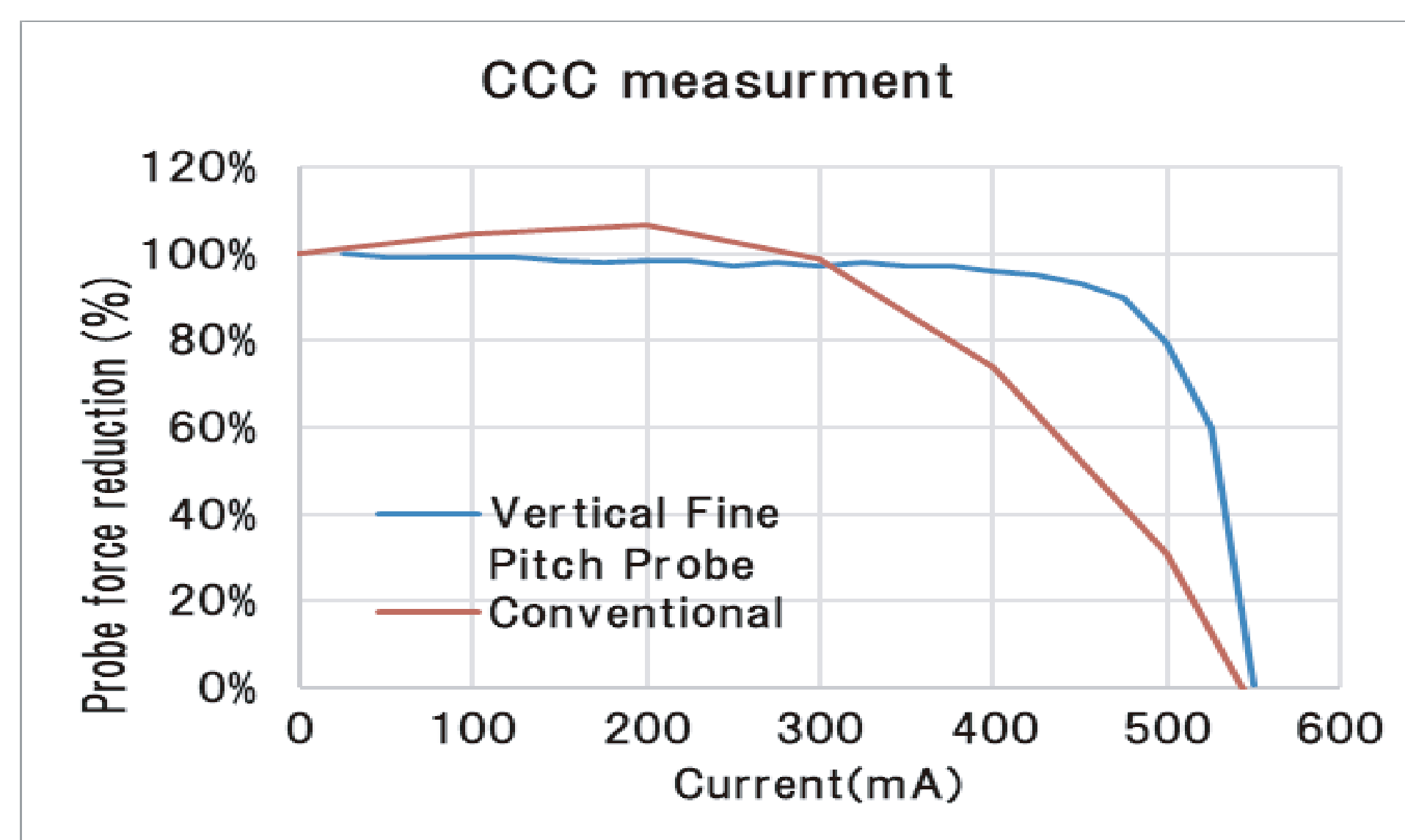


■ Fine pitch Probe specifications

Probe size	Min pitch	Overall length	Raw material	CCC	Probe force	Recommend Over drive
30 × 35um	55um	3600um	PdCo/Au/Rh	>400mA	1.5gf	75um

*55um未満も開発中 Less than 55um is also under development

■ Measurement result



ニデックSVプローブ株式会社
NIDEC SV PROBE CORPORATION

国内拠点

・東京(本社)
171-0014 東京都豊島区池袋4-32-8 サンボウ池袋ビル2階
TEL 03-6915-2820
・大阪
540-0026 大阪市中央区南本町2-3-1 ストック NE 3F
TEL 06-6945-4762
・熊本
869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼11-9 エヌ・アイ・シービル2F
TEL 096-288-4253
・北海道(生産拠点) ニデックSVプローブ電子株式会社
071-0502 北海道空知郡上富良野町西2線北25号

海外拠点

・シンガポール NIDEC SV PROBE PTE. LTD.
・アメリカ NIDEC SV PROBE INC.
・ベトナム NIDEC SV PROBE VIETNAM CO., LTD.
・台湾 NIDEC SV PROBE TAIWAN CO., LTD.
・中国 NIDEC SV PROBE SUZHOU CO., LTD.